Renishaw進一步増強VIONiC™光學尺系列性能

全球領先的工程科技公司Renishaw日前宣佈進一步増強VIONiC光學尺產品系列的性能。VIONiC光學尺的解析度現可達到2.5 nm，並且全系列產品的電子細分誤差 (SDE) 均有所降低。

VIONiC光學尺集成了Renishaw的光學濾波系統設計與細分技術，是一款超小型的高性能數位一體化增量式開放光學尺。其解析度範圍為5 µm至2.5 nm，並提供多種配置，客戶可相應選擇以優化運動控制系統的性能。由於安裝公差寬鬆並且可自動校準，因此VIONiC系列光學尺的安裝快捷簡單。VIONiC光學尺的動態信號處理功能可提供可靠的位置輸出，且電子細分誤差通常小於±15 nm\*，從而有助於實現卓越的運動控制性能。強VIONiC 的動態信號處理技術位置，標準細分誤差小於 ±15 nm，有助於實現優異的運動控制效能。

低電子細分誤差 (SDE) 有助於實現低速度紋波，這對於鐳射掃描測量系統等恒定速度應用來說十分重要。VIONiC光學尺的多功能細分晶片可實現8000 ×的細分值，這使讀數頭輸出解析度直接達到2.5 nm，因此極為適合高精度應用。VIONiC光學尺可與一系列線性尺和旋轉光學尺配用。

VIONiC光學尺系列還與可選的Advanced Diagnostic Tool (ADTi-100)相容，ADTi-100可進行全面的光學尺診斷，因此可用於要求苛刻的安裝場合和現場查錯。它的功能包括：遠端校準、在整個軸長上進行信號優化、讀數頭俯仰指示、限位和參考零位指示、DRO和利薩如圖形輸出。

VIONiC光學尺系列已獲得CE認證，由Renishaw嚴格按照通過了ISO 9001:2015認證的品質控制體系製造。與所有Renishaw光學尺產品一樣，VIONiC也由一個全球團隊支援，提供真正快捷的全球化服務。

**\*** *對安裝進行優化後可實現 <±10 nm的電子細分誤差 (SDE)。 如需瞭解更多詳情，請與當地的Renishaw業務代表聯繫。*

如需瞭解VIONiC光學尺的詳細資訊，請訪問 [www.renishaw.com.tw/VIONiC](http://www.renishaw.com/VIONiC).

**-結束-**